

# 半导体测电阻率，带电老化测试

产品名称	半导体测电阻率，带电老化测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

### 半导体测电阻率，带电老化测试

T3ster及其特点热瞬态测试仪T3Ster，用于半导体器件的先进热特性测试仪，同时用于测试IC、SoC、SIP、散热器、热管等的热特性。1.兼具JESD51-1定义的静态测试法（Static Mode）与动态测试法（Dynamic Mode），能够实时采集器件瞬态温度响应曲线（包括升温曲线与降温曲线），其采样率高达1微秒，测试延迟时间高达1微秒，结温分辨率高达0.01度。2.既能测试稳态热阻，也能测试瞬态热阻抗。3.满足JEDEC新的结壳热阻（ $\theta_{jc}$ ）测试标准（JESD51-14）。4.测试方法符合IEC 60747系列标准。5.满足LED的JESD51-51，以及LED光热一体化的测试标准JESD51-52。6.测试方法符合MIL-STD-883H method 1012.1和MIL-750E 3100系列的要求。7.结构函数分析法，能够分析器件热传导路径上每层结构的热学性能（热阻和热容参数），构建器件等效热学模型。8.可以和热仿真软件Flotherm，FloEFD无缝结合，将实际测试得到的器件热学参数导入仿真软件进行后续仿真优化。测试LED产品的相关参数：基板温度：室温~90度小采样时间间隔：1  $\mu$ s结温测试分辨率：0.01度典型电压测量分辨率：12  $\mu$ V